

Todo

Buscar

Tesis Doctoral

Miranda, Enrique A.. "[Mecanismos de conducción a través del aislante de puerta en estructuras MOS \(Metal-Oxido-Semiconductor\)](#)". (2002). Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.


[Registro](#)
[Resumen](#)
[Abstract](#)
[Citación](#)
[Estadísticas](#)

Registro:

Documento:	Tesis Doctoral
Disciplina:	fisica
Título:	Mecanismos de conducción a través del aislante de puerta en estructuras MOS (Metal-Oxido-Semiconductor)
Título alternativo:	Conduction mechanisms through the gate insulator in MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) structures
Autor:	Miranda, Enrique A.
Editor:	Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Filiación:	Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería - Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica
Publicación en la Web:	2017-03-01
Fecha de defensa:	2002
Fecha en portada:	2002
Grado Obtenido:	Doctorado
Título Obtenido:	Doctor en Ciencias Físicas
Director:	Faigón, Adrián
Idioma:	Español
Palabras clave:	MOS; SIO2; TUNEL; DEGRADACION; RUPTURA DIELECTRICAMOS; SIO2; TUNNELING; DEGRADATION; DIELECTRIC BREAKDOWN

Navegar

[Documento](#)
[Últimos publicados](#)
[Autor](#)
[Año](#)
[Título Obtenido - Año](#)
[Departamento - Año](#)
[Maestría y Doctorado](#)
[Director y Director Asistente](#)
[Jurado](#)
[Consejero de Estudios](#)

Colección

[Datos](#)
[Estadísticas](#)

Tema:	física/ingeniería electrónica física/física de los materiales
Formato:	PDF
Handle:	http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3464_Miranda
PDF:	https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n3464_Miranda.pdf
Registro:	https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n3464_Miranda
Ubicación:	Dep.FIS 003464
Derechos de Acceso:	<p>Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.</p> <p>Miranda, Enrique A.. (2002). <i>Mecanismos de conducción a través del aislante de puerta en estructuras MOS (Metal-Oxido-Semiconductor)</i>. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3464_Miranda</p>



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina
Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA - Tel. (+54 9 11) 5285-7400

[Biblioteca](#) | [Campus Virtual](#) | [Trámites](#) | [Intranet](#) | [Webmail](#) | [Contacto](#) | [UBA](#)